

國立交通大學

光電工程系

顯示科技研究所

碩士論文

低溫複晶矽薄膜電晶體在閘極交流訊號
下之劣化研究

**Study of N-type LTPS TFTs
Degradation Under Gate Pulse Stress**

研究生:陳建焜

Chien-Kun Chen

指導教授:戴亞翔 博士

Ya-Hsiang Tai

中華民國 九十五年 六月

N 型低溫複晶矽薄膜電晶體在閘極交流電壓
下的劣化研究

**Study of N-type LTPS TFTs Degradation
Under Gate Pulse Stress**

研究生：陳建焜

Student : Chien-Kun Chen

指導教授：戴亞翔 博士

Advisor : Dr. Ya-Hsiang Tai

國 立 交 通 大 學

光電工程學系 顯示科技研究所碩士班

碩 士 論 文



A Thesis

Submitted to Department of Photonics
Institute of Display

College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of

Master

in

Display

June 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中 華 民 國 九 十 五 年 六 月